

## テーマ 環境と信頼性・安全性の両立に向けて

**日程** 2010年7月15日(木)、16日(金) **会場** 日本教育会館(東京・千代田区一ツ橋) **発表時間** 持ち時間は1件につき30分(発表20分、質疑応答10分) **一般発表** 31件/チュートリアル講演・発表:8件/合計:39件  
**受付** 9:00~ (敬称略)

日	時間	A会場 第一会議室 (総合司会:益田 昭彦 帝京科学大学客員教授・組織委員会委員)		B会場		C会場		展示会場
7月15日(木)	9:30~9:35	主催者挨拶: (財)日本科学技術連盟 専務理事 三田 征史						
	9:35~10:20	【基調講演】「環境と信頼性・安全性の両立に向けて」 佐藤 吉信 東京海洋大学教授・組織委員会委員長						
	10:20~10:45	2009年度(第39回)R&MS推奨論文賞・奨励論文賞・特別賞 表彰式 賞状・副賞の授与: 佐藤 吉信 東京海洋大学教授・組織委員会委員長 選考理由について: 木村 忠正 電気通信大学名誉教授・報文小委員会委員長						
	10:45~10:55	休憩						
	10:55~12:25	【特別講演】「三洋電機における環境戦略と信頼性・安全性」 本間 充 三洋電機株式会社 取締役副社長						
	12:25~12:30	事務連絡:日科技連事務局						
	12:30~13:45	昼食休憩						
	13:45~14:15	1-1	太陽電池モジュールの良品構造解析手法 村原 大介 沖エンジニアリング(株)	3-1	信頼性に関するデータ解析へのSN比の応用 松岡 敏成 三菱電機コントロールソフトウェア(株)	5-1	Relex Reliability Studio 2009 原 良孝 テックサポートマネジメント(有)	【(1日目) 12:00~17:00 / (2日目) 10:00~15:00】 【出展会社】 ①テックサポートマネジメント(有) ②(株)東陽テクニカ ③楠本化成(株) ④(株)日本科学技術研修所 ⑤(株)日科技連出版社 ⑥日本信頼性学会 【世話人】 田中 克幸 (株)デンソー 井原 惇行 楠本化成(株) 二川 清 大阪大学
	14:15~14:45	1-2	BGAにおける導電性接着剤の強度 岡 克己 沖エンジニアリング(株)	3-2	Copulaの多重従属な競合リスクモデルにおける識別可能性問題への応用 米山 寛二 兵庫県立大学	5-2	HALT最新情報2010 —世界へ広がるHALT/IEEE ASTRでの発表事例— 川上 雅司 (株)東陽テクニカ	
	14:45~15:15	1-3	高輝度白色LEDの信頼性向上と評価 Byungjin Ma 韓国電子部品研究院	3-3	計算統計学を用いたワイブル分布型加速モデルに基づく信頼性解析 貝瀬 徹 兵庫県立大学	5-3	原因究明・信頼性試験のアウトソーシング 小林 吉一 楠本化成(株)	
15:15~15:45	休憩							
15:45~16:15	2-1	最新型ガスメーターを支える高分子材料技術 小澤 由規 大阪ガス(株)	4-1	信頼性テストのパフォーマンス向上に関する試み 長谷部 光雄 のつば技術開発研究所	6-1	構造損傷の拡大評価に対するバーコレーション・モデルの応用 伊藤 誠一 宇宙航空研究開発機構		
16:15~16:45	2-2	SQUID顕微鏡及びサーマルエミッション顕微鏡を利用した積層パッケージの非破壊検査の試行 照井 裕二 東芝アナリティクス(株)	4-2	衛星用スラスタにおける品質工学を用いた流量特性の改善 廣島 敬之 (株)IHIエアロスペース	6-2	interface-notch先端近傍の弾塑性ひずみ簡便評価法の提案 林 健治 トビー工業(株)		
16:45~17:15	2-3	装置安定稼働のためのEES適用事例 高橋 照明 東芝インフォメーションシステムズ(株)			6-3	スプライン用高潤滑グリースの開発 分根 聖司 (株)デンソー		
7月16日(金)	チュートリアル講演		【Session 7】 信頼性設計		【Session 10】 保全・設備診断		東京農工大学 仁田 周一 (益田)	
	日本のものづくりとサービスの革新を発信! これからの日本のものづくり、サービスの課題解決に貢献できるリーダーと信頼性技術者の育成 9:30~10:00 これからのものづくり、サービスのあり方 宮村 鐵夫 中央大学 10:00~10:45 関西電力の原子力部門における安全文化醸成活動について 白井 良平 関西電力(株) 10:45~11:30 デンソーにおける自動車部品の信頼性向上と技術者の育成 宮木 正彦 (株)デンソー		9:30~10:00 7-1 「品質問題」を無くす設計と設計審査No.2(仕組み・マネジメント改善、人材育成) 本田 陽広 (株)デンソー 10:00~10:30 7-2 統合的設計管理手法の研究(その3) —製品設計現場における適用事例の紹介— 吳 宏堯 (株)IHI 10:30~11:00 7-3 スライドドアガイドローラ統合化による開発期間短縮の実現 ~DRBFMと多変量解析法の併用による的確な検証・評価~ 尾子 禎宏 アイシン精機(株) 11:00~11:30 7-4 新製品開発設計におけるコンフィギュレーション・マネジメントの研究 杉野 敦 中央大学大学院		10:00~10:30 10-1 遠隔監視システムを用いたガスタービンプラントの異常診断 三上 尚高 三菱重工業(株) 10:20 10-2 RCM解析における保全方式選定の研究—劣化パターンのモデル化と予測— 里見 亮彦 中央大学大学院 10:30 10-3 運用・保全・工しやすい配電用変電所システムについて 糸谷 亮祐 関西電力(株)			
	11:30~12:15 昼食休憩		11:30~12:30 昼食休憩					
	日本信頼性学会「故障物性研究会によるセッション(1)」		【Session 8】 安全性					
	●チュートリアル発表 高信頼性時代に向けた信頼性技術 12:15~12:35 日本信頼性学会「故障物性研究会」の活動報告 土屋 英晴 アンデン(株) 12:35~13:00 コンデンサメーカーが創る信頼性 牧野 芳樹 ルビコン(株) 13:00~13:25 セットメーカーの部品実装における信頼性の作り込み 平山 良彦 セイコーインスツル(株) 13:25~13:50 調達部品の試験・解析(1) 試験・解析サービスの役割とセットメーカーへの提言 高森 圭 沖エンジニアリング(株) 13:50~14:15 調達部品の試験・解析(2) 高信頼性を実現するセットメーカーの試験・解析 本山 晃 パナソニック電工解析センター(株)		12:30~13:00 8-1 ソフトウェアに対する安全度レベル計算の一手法 藤原 隆次 ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ(株) 13:00~13:30 8-2 ETCシステム開発における製品安全設計の推進 森 康 三菱電機(株) 13:30~14:00 8-3 ソフトウェア製品の安全性向上のためのリスクマネジメント手法 河合 一夫 (株)プロムス 14:00~14:30 8-4 状態遷移モデルに基づく自動車ステアパイワイヤシステムの不安全事故率の推定式の検討 楠引 豪 (株)日本機能安全					
	14:15~14:30 休憩		14:30~15:00 休憩					
	日本信頼性学会「故障物性研究会によるセッション(2)」		【Session 9】 FMEA・FTA					
	●パネル討論 高信頼性時代に向けた信頼性技術と部品調達 コーディネーター: 味岡 恒夫 (株)東レリサーチセンター パネラー: 土屋 英晴 アンデン(株) ミツ石 進 NEC東芝スペースシステム(株) 藤本 直伸 三菱電機(株) 太田 周一 (株)リコー 小林 健二 日本電気(株) 牧野 芳樹 ルビコン(株) 高森 圭 沖エンジニアリング(株)		15:00~15:30 9-1 RFMEA(Risk Failure Mode and Effect Analysis)による点検業務プロセスのリスク分析 高 明淑 (株)東芝 15:30~16:00 9-2 優先ANDゲートを含むフォールトツリーの解析 阪田 隆司 京都大学大学院 16:00~16:30 9-3 順序依存故障論理をもつ非コヒーレントシステムのリスク解析 井野 孝 東京海洋大学					

**2009年度(第39回)R&MS推奨論文賞・特別賞**  
 表彰論文:発表論文の中から参加者の投票をもとに選出されます。  
 論文は、①創意性、②実用性、③完結性、④利用価値、⑤普遍性、⑥発表方法、⑦発表データの利用率の各項目で評価されます。  
 なお、2009年度の受賞論文は次のとおりです。(奨励論文賞の該当はありません。)  
**【推奨論文賞】**(発表セッション順・所属は受賞時のものです)  
 ・「品質問題」を無くす設計と設計審査 ○本田 陽広 (株)デンソー  
 ・統合的設計管理手法の研究(その2) —片持ち梁問題による多目的トレードオフ設計法の解説—  
 ○森 初男<sup>1)</sup>、吳 宏堯<sup>1)</sup>、鈴木 秀男<sup>2)</sup>、松浦 峻<sup>2)</sup>、長谷川 雄大<sup>2)</sup> :<sup>1)</sup>(株)IHI、<sup>2)</sup>慶應義塾大学  
 ・認定評価のための初期故障率の検証  
 ○松岡 敏成<sup>1)</sup>、井上 善裕<sup>1)</sup>、北 晃市<sup>2)</sup> :<sup>1)</sup>三菱電機コントロールソフトウェア(株)、<sup>2)</sup>三菱電機(株)  
**【特別賞】**(発表セッション順・所属は受賞時のものです)  
 ・半導体の各静電破壊試験方法の市場相関性の検討 ○田中 政樹 (株)ルネサステクノロジ  
 ・NITEの活動と今後の日本の製品安全はどうあるべきか ○長田 敏 (独)製品評価技術基盤機構

**7月15日(木)**  
 A会場 [Session 1] 電子部品・材料の信頼性(1)  
 B会場 [Session 3] データ解析  
 C会場 [Session 5] 最新信頼性・安全性解析(展示企業の発表)  
 司会(補佐): 楠本化成 井原 惇行 (田中(克))  
 展示会場: (1日目) 12:00~17:00 / (2日目) 10:00~15:00

**7月16日(金)**  
 A会場 [Session 2] 電子部品・材料の信頼性(2)  
 B会場 [Session 4] 品質工学と信頼性  
 C会場 [Session 6] 機械系  
 司会(補佐): 二川 清 (佐々木) 岩間 英雄 (門田) 田中 克幸 (藤本(良))



\*:プログラムの内容は変更になる場合がございます。